

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-235486

(43)Date of publication of application : 31.08.2001

(51)Int.Cl.

G01R 1/067

G01R 1/06

H01L 21/66

(21)Application number : 2000-043644

(71)Applicant : SEIKEN CO LTD

(22)Date of filing : 21.02.2000

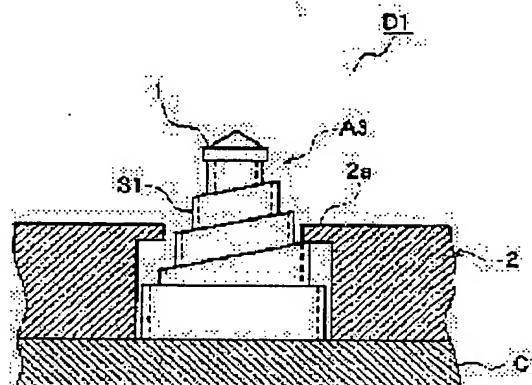
(72)Inventor : SHIRATORI NOBUO

(54) INSPECTION PROBE AND INSPECTION DEVICE WITH INSPECTION PROBE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the attenuation of a high-frequency electric signal when the electric signal is detected.

SOLUTION: When the probe part 1 of an inspection probe A3 is brought into contact with the terminal (not indicated in the figure) of a component to be inspected, the probe part 1 is brought surely into contact by the urging force of a spring part S1. As the spring part S1, a spiral spring part whose coil diameter becomes gradually small toward the inner circumferential side from the outer circumferential side is used, and its total length can be made short as compared with a spring part whose coil diameter is uniform. As a result, even when the high-frequency electric signal is detected, the attenuation of the electric signal can be reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 11.06.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 02.03.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998.2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-235486

(P2001-235486A)

(43) 公開日 平成13年8月31日 (2001.8.31)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ト*(参考)
G 0 1 R 1/067		G 0 1 R 1/067	C 2 G 0 1 1
1/06		1/06	A 4 M 1 0 6
H 0 1 L 21/66		H 0 1 L 21/66	B

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2000-43644 (P2000-43644)

(22) 出願日 平成12年2月21日 (2000.2.21)

(71) 出願人 592156633

株式会社精研

東京都大田区蒲田本町2丁目2番3号

(72) 発明者 白島 信夫

東京都大田区蒲田本町2丁目2番3号 株式会社精研内

(74) 代理人 100082337

弁理士 近島 一夫 (外1名)

Fターム(参考) 2G011 AA09 AB01 AB06 AB07 AC14

AC32 AE03 AF07

4M106 AA01 AA02 AD26 BA01 CA01

DD03 DD15

(54) 【発明の名称】 検査用プローブ、及び該検査用プローブを備えた検査装置

(57) 【要約】

【課題】 高周波電気信号を検出する際における電気信号の減衰を低減する。

【解決手段】 検査用プローブ A 3 の探針部 1 を被検査部品の端子 (不図示) に接触させた場合、該探針部 1 はスプリング部 S 1 の付勢力によって確実に接触される。ここで、スプリング部 S 1 には、外周側から内周側にかけてコイル径が次第に小さくなる渦巻き状のものを用いているため、コイル径が均一なものに比べて全長を短くできる。その結果、スプリング部のインピーダンスを小さくでき、高周波電気信号を検出するに当たっても電気信号の減衰を低減できる。

